



Application de l'ACP par intervalles au diagnostic

**José Ragot, Gilles Mourot,
Kamel Benothman, Anissa Ben Aicha**

Centre de Recherche en Automatique de Nancy

LARA Automatique - ENIT



Points principaux

Objectifs de l'étude

- ▶ Supervision de systèmes
- ▶ Détection de défauts (FD)
- ▶ Isolation de défauts (FI)
- ▶ Caractérisation de défauts
- ▶ Garantie du diagnostic

Hypothèses de travail

- ▶ Systèmes linéaires
- ▶ Pas de modèle a priori
- ▶ Erreurs de mesures bornées

Mesure intervalle

$$x = x^* + \varepsilon, \quad |\varepsilon| \leq \delta$$
$$x \in [x_{min} \quad x_{max}]$$

Plan

- 1 Rappels sur l'ACP
- 2 Application au diagnostic
- 3 Application
- 4 Conclusion

- ▷ Les erreurs de mesure peuvent être assimilées à des variables bornées
- ▷ Ce travail propose une nouvelle méthode d'extension de l'ACP à des données de type intervalle.
- ▷ Le modèle ainsi obtenu est un modèle ACP par intervalle. L'application de l'ACP intervalle au diagnostic sera également présentée.
- ▷ Cette nouvelle méthode a été validée par un exemple de simulation. Des essais sont en cours sur un parc de pompes.

- ▶ Vecteur de mesures à l'instant k

$$\mathbf{x}^*(k) = (x_1^*(k) \ x_2^*(k) \ \dots \ x_m^*(k))^T$$

- ▶ Matrice des données

$$\begin{aligned}\mathbf{X}^* &= (\mathbf{x}^*(1) \ \cdots \ \mathbf{x}^*(N))^T \\ &= \begin{pmatrix} x_1^*(1) & x_2^*(1) & \cdots & x_m^*(1) \\ x_1^*(2) & x_2^*(2) & \ddots & x_m^*(2) \\ \cdots & & & \\ x_1^*(N) & x_2^*(N) & \ddots & x_m^*(N) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

- ▶ Modèle *ACP*
 - Valeurs et vecteurs propres de la matrice $\mathbf{X}^{*T} \mathbf{X}^*$
- ▶ Influence des erreurs de mesure
 - Modification des vecteurs propres
 - Analyse de sensibilité du modèle ACP

Modèle ACP intervalle

- ▶ Matrice de mesures

$$\mathbf{X}^*$$

- ▶ Matrice de variance-covariance

$$\mathbf{A}^* = \mathbf{X}^{*T} \mathbf{X}^*$$

- ▶ Matrice de mesures perturbée

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}^* + \delta\mathbf{X}$$

- ▶ Nouvelle matrice de variance-covariance

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^* + \delta\mathbf{A}$$

$$\text{où } \delta\mathbf{A} = \mathbf{X}^{*T} \delta\mathbf{X} + \delta\mathbf{X}^T \mathbf{X}^* + \delta\mathbf{X}^T \delta\mathbf{X}.$$

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^* v_i^* &= \lambda_i^* v_i^* \\ (\mathbf{A}^* + \delta\mathbf{A})(v_i^* + \delta v_i) &= (\lambda_i^* + \delta\lambda_i)(v_i^* + \delta v_i)\end{aligned}$$

Modèle ACP intervalle

- On peut montrer que :

$$\begin{pmatrix} \delta v_i \\ \delta \lambda_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}^* - \lambda_i^* I & -v_i^* \\ v_i^{*T} & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -\delta \mathbf{A} \cdot v_i^* \\ 0 \end{pmatrix}$$

- On réitère cette évaluation pour N réalisations $\delta \mathbf{A}(k), k = 1, \dots, N$
- On génère ainsi un ensemble de valeurs $\delta v_i(k)$ et $\delta \lambda_i(k)$.
- On en déduit les bornes des valeurs et vecteurs propres :

$$\begin{cases} \lambda_{i \min} = \inf_k (\lambda_i^* + \delta \lambda_i(k)) \\ \lambda_{i \max} = \sup_k (\lambda_i^* + \delta \lambda_i(k)) \end{cases} \quad i = 1, \dots, m$$

$$\begin{cases} v_{i,j \min} = \inf_k (v_{i,j}^* + \delta v_{i,j}(k)) \\ v_{i,j \max} = \sup_k (v_{i,j}^* + \delta v_{i,j}(k)) \end{cases} \quad i = 1, \dots, m$$

ACP. Réduction de variables

► Définition

$$X = TP^T, \quad T = (t_1 \ \dots \ t_m) \in \mathcal{R}^{N \times m} : \text{composantes principales}$$

$$T = XP, \quad P = (p_1 \ \dots \ p_m) \in \mathcal{R}^{m \times m} : \text{vecteurs propres}$$

$$\Sigma = P\Lambda P^T, \quad \Lambda = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_m) \in \mathcal{R}^{m \times m} : \text{valeurs propres}$$

► Décomposition de la matrice de variance-covariance

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda^{(\ell)} & 0 \\ 0 & \Lambda^{(m-\ell)} \end{pmatrix} \quad P = (P^{(\ell)} \mid P^{(m-\ell)}) \quad T = (T^{(\ell)} \mid T^{(m-\ell)})$$

$$X = \hat{X} + \tilde{X}$$

$$\hat{X} = XC^{(\ell)}$$

$$C^{(\ell)} = P^{(\ell)}P^{(\ell)T}$$

$$\tilde{X} = XC^{(m-\ell)}$$

$$C^{(m-\ell)} = I_m - P^{(\ell)}P^{(\ell)T}$$

Diagnostic. Projection des mesures

- Le diagnostic de fonctionnement de système comporte deux phases complémentaires : la détection et la localisation de défauts.
- Considérons, à l'instant k , un vecteur de mesure $x(k)$. Comment savoir si cette mesure peut être considérée comme valide ou au contraire entachée de valeurs aberrantes ?
- Comment détecter et localiser la composante aberrante de la mesure ?
- La projection du vecteur des mesures $x(k)$ dans les deux sous-espaces est définie par :

$$[\hat{x}(k)] = [C_\ell] \mathbf{x}(k)$$

$$[\tilde{x}(k)] = (I - [C_\ell]) \mathbf{x}(k)$$

L'indice ℓ rappelle que la reconstruction est faite à partir de ℓ composantes principales.

- Analyse des résidus $[\tilde{x}(k)]$

Diagnostic. Reconstruction de variables

- ▶ Reconstruction de la variable de rang i

$$[\hat{x}_i(k)] = \frac{\sum_{j=1, j \neq i}^m [c_{ij}] x_j(k)}{1 - [c_{ii}]}$$

- ▶ Vecteur issu de la reconstruction

$$[\hat{x}_R^{(i)}(k)] = (x_1(k) \ \dots \ x_{i-1}(k) \ [\hat{x}_i(k)] \ x_{i+1}(k) \ \dots \ x_m(k))$$

$$[\hat{x}_R^{(i)}(k)] = [G_\ell^{(i)}] x(k)$$

$$[G_\ell^{(i)}] = I + \frac{\xi_i \xi_i^T}{1 - \xi_i^T [\hat{C}_\ell] \xi_i} ([\hat{C}_\ell] - I)$$

- ▶ Analyse des résidus $[\tilde{x}^{(i)}(k)] = x(k) - [\hat{x}_R^{(i)}(k)]$

Diagnostic. projection des reconstructions

- Projection des reconstructions dans l'espace résiduel :

$$\left[\tilde{x}_R^{(i)}(k) \right] = (I - [C_\ell]) \left[\hat{x}_R^{(i)}(k) \right]$$

$$\left[\tilde{x}_R^{(i)}(k) \right] = [P_\ell] x(k) \quad [P_\ell] = (I - [C_\ell]) [G_\ell]$$

- Expression d'une mesure en fonction des grandeurs vraies x^* , des bruits de mesure ε et d'un défaut f intervenant dans une direction ξ_f :

$$x(k) = x^*(k) + \varepsilon(k) + \xi_f f(k)$$

- Projection ou résidu :

$$\begin{aligned} \left[\tilde{x}_R^{(i)}(k) \right] &= [P_\ell](x^*(k) + \varepsilon(k) + \xi_f f(k)) \\ &= [P_\ell]\varepsilon(k) + [P_\ell]\xi_f f(k) \end{aligned}$$

En résumé : 3 sources d'information pour le diagnostic

- Projection des données dans l'espace résiduel
- Reconstruction des données
- Projection des reconstructions dans l'espace résiduel

Application

On considère un système statique régi par 7 variables $x_j; j = \{1, \dots, 7\}$ et décrit aux différents instants k par les équations suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1^*(k) = 0.4v_1(k) + \sin(k/N), \quad v_1(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \\ x_2^*(k) = v_2(k) - 2\cos(k/4), \quad v_2(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \\ x_3^*(k) = 0.2v_3(k) - 1, \quad v_3(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2) \\ x_4^*(k) = x_1^*(k) + x_2^*(k) \\ x_5^*(k) = x_2^*(k) + x_3^*(k) \\ x_6^*(k) = 2x_1^*(k) + x_3^*(k) \\ x_7^*(k) = x_4^*(k) + x_5^*(k) \end{array} \right. \quad (1)$$

Application

Données générées à partir de 3 variables issus de 3 lois normales, fait apparaître quatre relations de redondance analytique linéaires entre les variables $x_i^*, i = 1, \dots, 7$.

Des variations $\delta\mathbf{X}$, réalisations de variables aléatoires centrées de façon à simuler la présence de bruits de mesure.

Système simulé sur une fenêtre de $N = 100$ observations. L'évolution des mesures des variables $x_j, j = 1, \dots, 7$, en présence de défauts, est illustrée sur la figure.

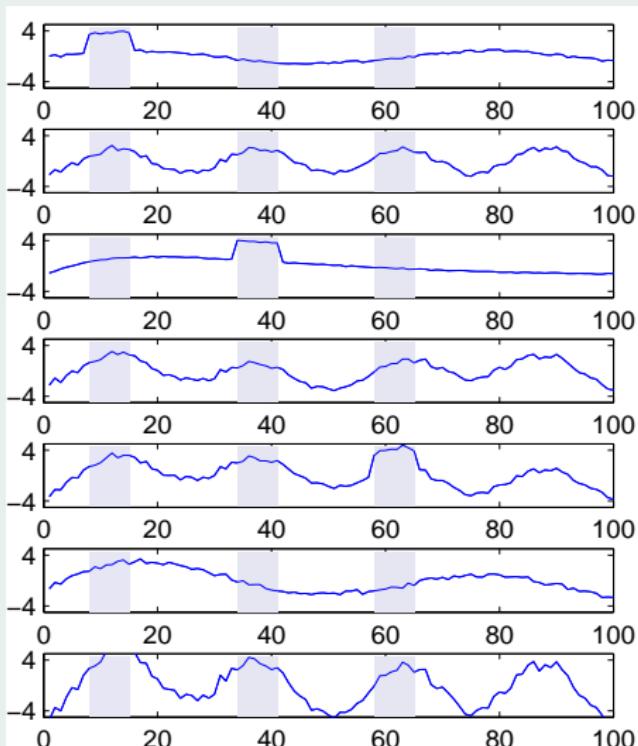


FIGURE: Variables en présence de défaut

Application

L'examen conjoint de ces relations et des vecteurs propres intervalle de la table 1 montrent la cohérence des estimations de ces vecteurs propres.

0	0	0	1	[0.95 1.06]	[-0.02 0.03]	[-1.03 -0.97]
0	0	1	0	[-1.37 -1.29]	[-0.35 -0.32]	[0.65 0.69]
0	1	0	0	[0.30 0.37]	[0.32 0.35]	[-0.68 -0.65]
1	0	0	0	[0.64 0.68]	[-0.34 -0.32]	[-0.34 -0.32]

TABLE: Matrice des 4 derniers vecteurs propres intervalle

Application

Défauts ajoutés à la x_1 des instants 8 à 15 (zone Z_1), à x_3 des instants 34 à 41 (zone Z_2) et à x_5 des instants 58 à 65 (zone Z_3).

Vecteurs résidus $[\tilde{x}_R^{(1)}(k)]$ sans utiliser la première variable.

Vecteurs résidus $[\tilde{x}_R^{(2)}(k)]$ sans utiliser la deuxième variable.

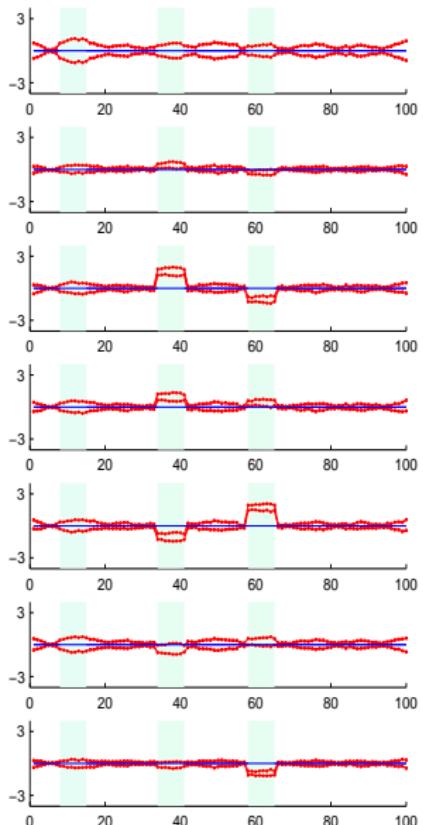


FIGURE: Résidus $[\tilde{x}_R^{(1)}]$

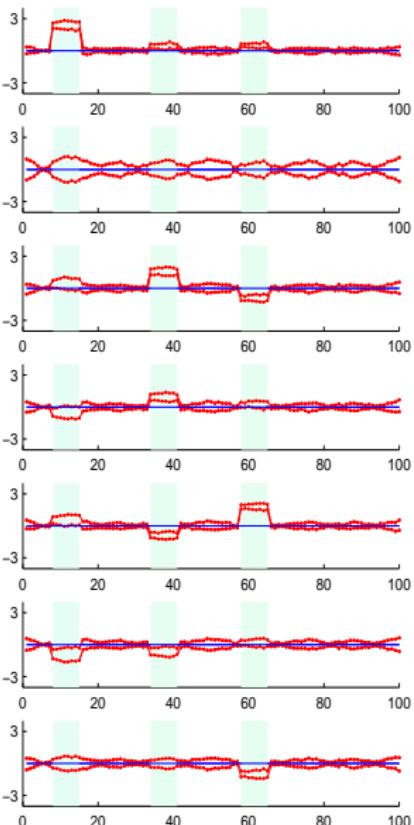


FIGURE: Résidus $[\tilde{x}_R^{(2)}]$

Application

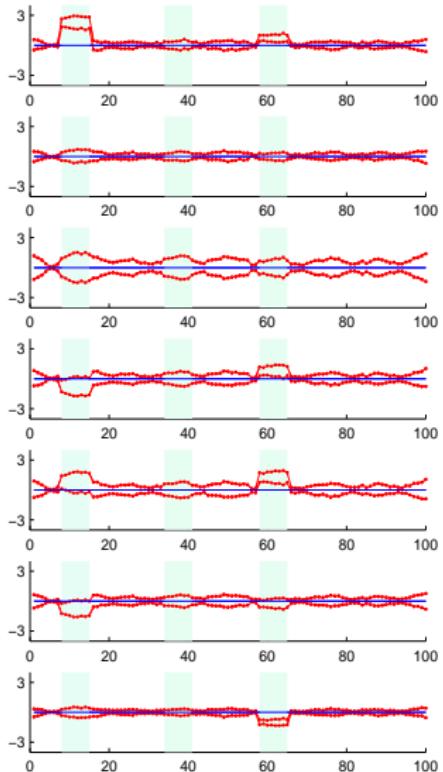


FIGURE: Résidus $[\tilde{x}_R^{(3)}]$

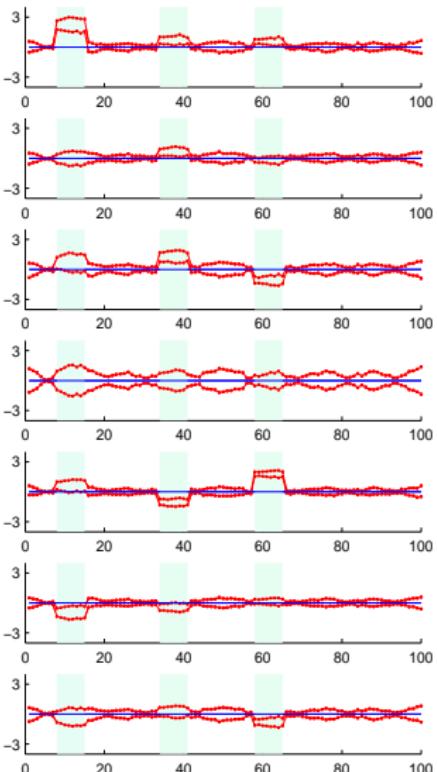


FIGURE: Résidus $[\tilde{x}_R^{(4)}]$

Vecteurs résidus
 $[\tilde{x}_R^{(1)}(k)]$ sans utiliser la troisième variable.

Vecteurs résidus $[\tilde{x}_R^{(2)}(k)]$ sans utiliser la quatrième variable.

Application

	$\tilde{x}_R^{(1)}$	$\tilde{x}_R^{(2)}$	$\tilde{x}_R^{(3)}$
δx_1	0 0 0 0 0 0 0	\times 0 \times \times \times \times \times	\times \times 0 \times \times \times \times
δx_2	0 \times \times \times \times \times \times	0 0 0 0 0 0 0	\times \times 0 \times \times \times \times
δx_3	0 \times \times \times \times \times \times	\times 0 \times \times \times \times \times	0 0 0 0 0 0 0
δx_4	0 \times \times \times \times \times \times	\times 0 \times \times \times \times \times	\times \times 0 \times \times \times \times
δx_5	0 \times \times \times \times \times \times	\times 0 \times \times \times \times \times	\times \times 0 \times \times \times \times
δx_6	0 \times \times \times \times \times \times	\times 0 \times \times \times \times \times	\times \times 0 \times \times \times \times
δx_7	0 \times \times \times \times \times \times	\times 0 \times \times \times \times \times	\times \times 0 \times \times \times \times

TABLE: Signatures théoriques des défauts

Application

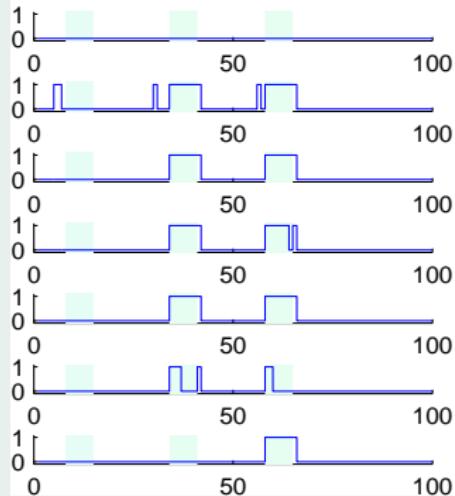


FIGURE: Indicateurs de défauts sans utiliser la variable 1

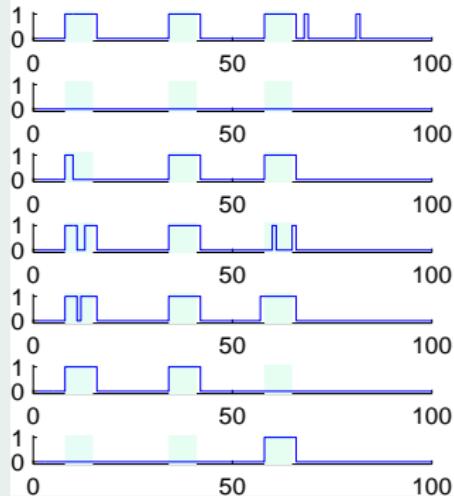


FIGURE: Indicateurs de défauts sans utiliser la variable 2

Application

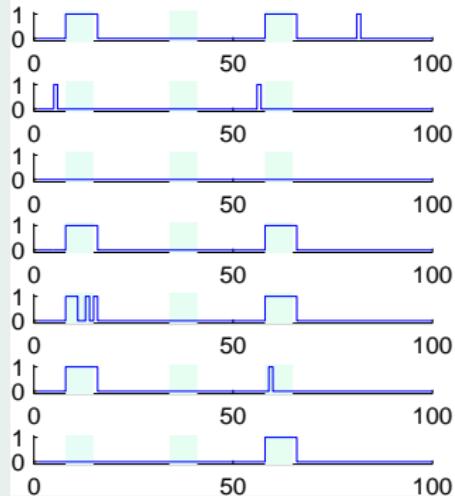


FIGURE: Indicateurs de défauts sans utiliser la variable 3

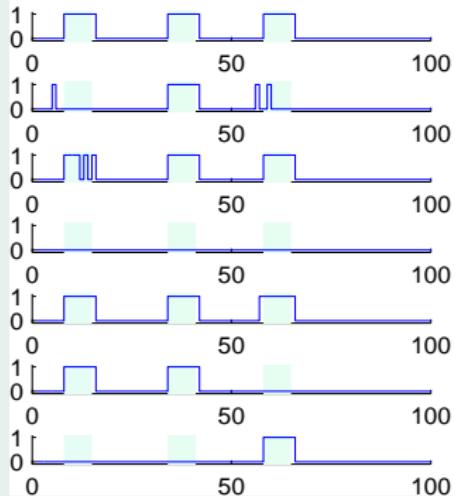


FIGURE: Indicateurs de défauts sans utiliser la variable 4

Application

$Zone Z_1$	0 0 0 0 0 0 0	$\times 0 \times \times \times \times 0$	$\times 0 0 \times \times \times 0$
$Zone Z_2$	0 $\times \times \times \times \times 0$	$\times 0 \times \times \times \times 0$	$0 0 0 0 0 0 0$
$Zone Z_3$	0 $\times \times \times \times 0 \times$	$\times 0 \times \times \times 0 \times$	$\times 0 0 \times \times 0 \times$

TABLE: Signatures expérimentales des défauts

	$\tilde{x}_R^{(1)}$	$\tilde{x}_R^{(2)}$	$\tilde{x}_R^{(3)}$
δx_1	0 0 0 0 0 0 0	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$\times \times 0 \times \times \times \times$
δx_2	0 $\times \times \times \times \times \times$	$0 0 0 0 0 0 0$	$\times \times 0 \times \times \times \times$
δx_3	0 $\times \times \times \times \times \times$	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$0 0 0 0 0 0 0$
δx_4	0 $\times \times \times \times \times \times$	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$\times \times 0 \times \times \times \times$
δx_5	0 $\times \times \times \times \times \times$	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$\times \times 0 \times \times \times \times$
δx_6	0 $\times \times \times \times \times \times$	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$\times \times 0 \times \times \times \times$
δx_7	0 $\times \times \times \times \times \times$	$\times 0 \times \times \times \times \times$	$\times \times 0 \times \times \times \times$

TABLE: Signatures théoriques des défauts

Application

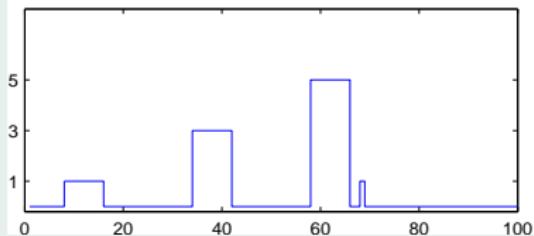


FIGURE: Indicateurs de localisation de défauts

- Prise en compte de mesures sous forme intervalle
- Pas d'hypothèse de loi de distribution des erreurs de mesure
- Modèle ACP sous forme intervalle

Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention !

